

Se F6

II - 1453

SF₆, SeF₆, TeF₆ (χ_{S-F} ; χ_{Se-F} ; χ_{Te-F}) 1933

Braune H., Knoke S.

Z. physik. Chem. 1933, B21, 297-309

"Electron diffraction by gaseous
SF₆, SeF₆ and TeF₆".

C.A., 1933, 4160

1-0

II-1452

SF_6 , SeF_6 , TeF_6 ($\chi_{\text{S-F}}$; $\chi_{\text{Se-F}}$; $\chi_{\text{Te-F}}$) 1933

Brockway L.O., Pauling L.
Proc. Natl. Acad. Sci., 1933,
19, 68-73

"The determination of the
structures of the hexafluorides of
sulfur, selenium and tellurium by
the electron diffraction method"

10

C.A., 1933, 3160

II 1355

SF₆; SeF₆; TeF₆ (Mark. not.)

1934

Yost D.M., Steffens C.C., and Gross S.T.
1. J. Chem. Phys. 2, 311 (1934)

The Raman spectra and molecular constant
of the hexafluorides sulfur, selenium und
tellurium

Circ. 500
Kelley, bull. 592, c. 109

11 1359

1935

SF_6 , SeF_6 , TeF_6 (молек. вес.)

Sachsse H., Bartholomé E.

Das Ultrarotspektrum; die Normal-
schwingungen und die intramolecularen
Kräfte bei SeF_6 und TeF_6

Ztschr. physikal. Chem., 1935, 28B, 257

Kelley, bull. 592, c. 875

II 1365
SeF₆ (J , mol. mol.)

1936

Brockway L.O.

Electron diffraction by gas
molecules

Rev. Modern Phys., 1936, 8, 231

Kelley, bull. 592,
c. 117

10



11357 SerF₆, TeF₆ (ungen. von.) 1936

Lucken A., Bertram A.

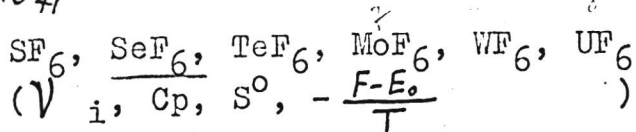
Die Ermittlung der Molwärme einiger
Gase bei tiefen Temperaturen nach der
Wärmeleitfähigkeit.

Ztschr. physikal. Chem., 1936, 31B, 361

Kelley, bull. 592, c. 313

II-1071

I953



Gaunt J.

Trans. Faraday Soc., I953, 49, N IO, II22-
II3I (англ.)

The infra-red spectra and molecular structure of some group 6 hexafluorides.

PX, I954, N 9, 24895.

10

суб гр. к. $\sqrt{\phi}$

II-1073

Структура молекул

1953

PCl_2F_3 , TeCl_4 , BrF_3 , JCl_3 , $(\ddot{\text{J}}\text{O}_2\text{F}_2)\text{SF}_6$, SeF_6 ,
 $\text{Te}(\text{OH})_6$, JF_5

Palmer W.G.

Endeavour, 1953, 12, 124-9.

Stereochemistry: its basis and application
to inorganic compounds.

Ch.A., 1953, 9686e

II - 1068

БЗР - 7024 - II

1956

SeF₆, TeF₆ (Vi)

Burke T.G.

J. Chem. Phys., 1956, 25, N 4, 791-792
(англ.)

Инфракрасные спектры гексафторида селена
и гексафторида теллура.

РЖХ, 1957, № 14, 47089

всего 95 к. (1)

Вор-812-V

1956.

SeF₆

Venkateswarlu K.
Sundaram S.

Z. Phys. Chem. 1956,
9, 13-4, 174-9.

В;
сильности

сильности

Выводы
мощ. молекулы типа XY₆.

XF_6 (силовые постоянные)

$\text{X}=\text{S}, \text{Se}, \text{Te}, \text{Mo}, \text{W}, \text{U}, \text{Re}, \text{Ir}, \text{Np}, \text{Pu}.$

Califano S.

Atti, Accad. naz. Lincei. Rend. Cl. sci. fis.
mat. e natur., 1958, 25, N 5, 284-291.

Силовые постоянные гексафторидов.

РЖХ, 1959, № 21.

73864

Bp-813-V

1958.

SeF₆

Pistorius C.W.F.T.

J. Chem. Phys., 1958,
29, N6, 1328-32.

Di. енд.
'ност.

помену. поле и енд.
ност. октаэдр. молек.

II-1332

SeF_6 (СИЛОВЫЕ ПОСТОЯННЫЕ)

1959

Linnett J.W., Simpson C.J.S.M.
Trans. Faraday Soc., 1959, 55, N 6,
857-866

Молекулярные силовые поля.
Часть I7. Общее силовое поле гексафторидов

РХ., 1960, N 5, 16590

(10)

всего гр. к. ✓ гр

1959

Sep₆

Weinstock B., Claassen H.H.

Изопреки Дмана-Темера

В колебательных спектрах
гексафторидов - J. Chem. Phys.,
1959, 31, 262.

III (SF₆)

1490-II

SeF₆ (*crystal*)

1962

Meisingseth E., Cyvin S.J.

Acta chem.scand., 1962, 16,

N 10, 2452-2453 (*crystal*)

Mean amplitudes of vibration
and Bas tiansen-Morino shrinkage
effects in some octahedral XY₆
molecules

PX., 1963, 24538

I962

SeF₆, TeF₆

Weistock Bernard

Rec. Chem. Progr., 1962, 23, N I, 23

Некоторые св-ва молекул гексафторидо

см. SF₆

III (SF₆)

II-1529

SeF₆ (l_{S-F})

BP-7024-II

1963

Ewing V.C., Sutton L.E.

Trans. Faraday Soc., 1963, 59,
II 6, 1241-1247 ()

Investigation by electron
diffraction of the molecular structure
of sulphur hexafluoride, sulfur
tetrafluoride, selenium hexafluoride
and selenium tetrafluoride

P.P., 1963, 125157

весь спус.
10

1057-11

1963

BF₆, SeF₆, TeF₆, IOF₆, POF₆, UF₆

AsF₆, SbF₆ (molecule used.)

Kimura H., Kimura K.

J. Mol. Spectry, 1963, 11 (5), 368-77

The mean square amplitudes
of interatomic distances in hexafluoride
molecules

SA, 1964, 6051: 2, 1229H

U-1631-BP; BP-5011-II

1963

W_i (CH_4 , CD_4 , CF_4 , SiF_4 , SF_6 , SeF_6 , TeF_6)

Long D.A., Thomas E.L.,

Trans. Faraday Soc., 1963, 59, N 5,
1026-1032 (.)

Raman intensities. Part 9.

Vibrational intensities for
spherically ...

PP, 1964, 5D145

10

Есть оригинал.

1963
VI-3487

SF₆, SeF₆, TeF₆, MoF₆,

WF₆, UF₆, NpF₆, PuF₆,

ReF₆ OsF₆, IrF₆, PtF₆ (Vi, sil. post.)

Nagarajan G.

Bull Soc. chim. belg., 1963, 72, N 3-4,
276-285.

Est/orig.

RX., 1964, 4532

J

S

VI-2091 1963

W_i(SF₆, SeF₆, TeF₆, MoF₆,
WF₆, UF₆, NpF₆, PuF₆, ReF₆, OsF₆,
IrF₆, PtF₆)

Nagarajan G.

Bull. Soc. chim. belg., 1963, 72, N 7-8,
537-59.

Mean amplitudes of vibration of some
octahedral XY₆ type molecules.

RX., 1964, 7534

Est/orig.
J. Org. C. Anal.

5

XY, Z_6 (mol.post.)

A-893

1964

SF_6 , SeF_6 , TeF_6 , MoF_6 ,

TcF_6 , RuF_2 , RhF_6 , WF_6 , ReF_6 , OsF_6 , IrF_6 ,

PtF_6 , UF_6 , NpF_6 , $RuF_6(V, \text{ sil.post.})$

Meisingseth E., Brunvoll J., Cyvin S.I.

Kgl.norske vid.selskabs skr, 1964, N7, 49.

Normal-coordinate analysis of rotation-vibration of octahedral XY_6 and Z_6 molecular models with application to $15XY_6$ molecules.

RX., 1966, 13/153 J

-A-547.

1965

MeF6, rge Me = Ir, Os, Rh, Pt, Ru, Re,
Co, Mo, Tc, W, U, Np, Po, Pu, Se, S, Te (Vi)

Weinstock B., Goodman G.L.

Advances Chem. Phys., vol 9, London-
New York, - Sydney, Interscience,
1965, 169-319

PMLX, 1966, 135150

10.

M=Se

Nagarajan I.

1866

Indian J. Pure and Appl.
Phys., 4, 16, 237.

Средние амплитуды и частоты
всех движений и сокраще-
ния химических связей.

Окислительные гексагидро-
пигменты.

1 an M=Se. III(SF₆)

$M=Se$ Thakur S.N., Rai D.K. 1966

J. Molec. Spectrosc., 19, 14, 341.

Дивовижне поведінкове
ексцитуційне явище

(ан. $M=Se$)
 $\text{III} (\text{SF}_6)$

20 Б246. Анализ колебательных спектров молекул SeF_6 и WF_6 . Abramowitz / Stanley, Levin
Ита W. Vibrational analysis of SeF_6 and WF_6 . «Inorgan.
Chem.», 1967, 6, № 3, 538—541 (англ.)

Исследованы ИК-спектры молекул SeF_6 и WF_6 в газообразном состоянии. По величине интервала между R-и R-ветвями полос, соотв-щих трижды вырожденным колебаниям типа F_{1u} найдены значения постоянных корнолисового взаимодействия (ζ_i), которые использованы для вычисления силовых коэф. класса F_{1u} этих молекул. Значения силовых коэф. наиболее общего силового поля, найденные здесь, сопоставлены с их значениями, полученными при помощи приближенного модифицированного силового поля Юри—Бредли и показано, что поле Юри—Бредли приводит к несовместимым с экспериментом значениям ζ -постоянных. Отмечено, что силовой коэф. взаимодействия F_{3u} для ряда молекул SF_6 , SeF_6 и TeF_6 имеет большое отрицательное значение и с увеличением массы центрального атома уменьшается.

М. Р. Алиев

X. 1987. 20

四

SeF₆

1967

111 Д351. Анализ колебательных спектров молекул SeF₆ и WF₆. Abramowitz Stanley, Levin Ira W.
Vibrational analysis of SeF₆ and WF₆. «Inorgan. Chem.», 1967, 6, № 3, 538—541 (англ.)

Исследованы ИК-спектры молекул SeF₆ и WF₆ в газообразном состоянии. По величине интервала между *P*- и *R*-ветвями полос, соответствующих трижды вырожденным колебаниям типа F_{1u} , найдены значения постоянных корiolисового взаимодействия (ξ_i), которые использованы для вычисления силовых коэф. класса F_{1u} этих молекул. Значения силовых коэф. наиболее общего силового поля, найденные здесь, сопоставлены с их значениями, полученными при помощи приближенного моди-

м. и.;

м. и. пот.;

до. 1967. 112

ⓧ

фицированного силового поля Юри — Брэдли, и показано, что поле Юри — Брэдли приводит к несовместимым с экспериментом значениям постоянных ξ . Отмечено, что силовой коэф. взаимодействия F_{34} для ряда молекул SF_6 , SeF_6 и TeF_6 имеет большое отрицат. значение и с увеличением массы центрального атома уменьшается.

М. Р. Алиев

SeF₆

1967

180604a Vibrational analysis of SeF₆ and WF₆. Stanley Abramowitz and Ira W. Levin (Natl. Bur. of Stds., Washington, D.C.). *Inorg. Chem.* 6(3), 538-41(1967)(Eng). The gas-phase ir vibration-rotation spectra of SeF₆ and WF₆ have been measured in the region of their fundamental absorption bands. Coriolis coupling consts., evaluated from the observed contours, are used as constraints for the general force fields for these mols. 16 references. RCHH

v_i

can. wocs.

+1

C.A. 1967. 66. 18

M. N. CHEM. NOT. (SF₆, SeF₆, TeF₆, 1968

MoF₆, WF₆, UF₆, NpF₆, PuF₆, BP
RhF₆, IrF₆, PtF₆) ~~6289~~ 6289
Cyrin S F, Brunnell F, Müller A.

Acta Chem. Scand., 1968, 22, 18, 2739-2741
(Comm)

Revised mean amplitudes of vibration
for some octahedral hexafluorides.

Puckner, 1968, 12565

14

молек. вес, сум. вес (BeCl₄, OsO₄, 1968

BP-V(5374

RuO₄, GeF₄, BF₃,

SO₂, RuF₄, WF₆,

IrF₅, PtF₆, SeF₆, TeF₆)

Кебаб, озон L., Мюллер

Z. naturforsch., 1968, 23a, 49, 1310-1312 (lang)

Einfache Formeln zur Abschätzung
von Cridlis-Kopplungskonstanten k_f
zur Massenabhängigkeit von γ -Werten

ИОТБ Ф. Н.

Казань, 1969, 30-172

10

(9)

35

SeF₆

B9p-4265-VI

1968

12 Д144. Молекулярные силовые поля октаэдрических молекул типа XF₆. Kim Hyunyoung, Souder Paul A., Claassen Howard H. Molecular force fields of octahedral XF₆ molecules. «J. Molec. Spectrosc.», 1968, 26, № 1, 46—66 (англ.)

Методом наименьших квадратов вычислены силовые коэф. орбитального валентного силового поля (ОВСП) 15 октаэдрич. молекул XF₆, где X = S, Se, Te, Mo, Tc, Ru, Rh, W, Re, Os, Ir, Pt, U, Np, Pu. Получены явные выражения силовых коэф. наиболее общего валентного силового поля через силовые коэф. ОВСП. При расчете использованы частоты основных колебаний и в некоторых случаях постоянные кориолисова взаимодействия (ζ_i) для трижды вырожденных классов симметрии.

09.1968. 12Д

К

найденные по интервалам между P - и R -ветвями неразрешенных контуров ИК-полос. Экспериментально измерены ζ -постоянные для класса F_{1u} молекул RhF_6 , WF_6 и IgF_6 . Для этих молекул построены графики зависимости силовых коэф. F_{33} и F_{44} и постоянных ζ_3 и ζ_4 от коэф. F_{34} , по которым определены значения F_{34} . Результаты расчета для ряда молекул сопоставлены с данными, полученными при помощи силового поля Юри — Брэдли (Ю — Б). Показано, что для валентных силовых коэф. результаты ОВСП и поля Ю — Б совпадают, а для деформационных силовых коэф. ОВСП приводит к лучшему согласию между вычисленными и опытными значениями частот и ζ -постоянных, чем поле Ю — Б. Отмечена сильная зависимость деформационного коэф. в ОВСП и коэф. отталкивания в поле Ю — Б от числа несвязывающих электронов в $4d$ - и $5d$ -оболочках центрального атома.

М. Р. Алиев

Chem. nos (SF₆, SeF₆, TeF₆¹², MoF₆, 1268
WF₆, UF₆) 87 VII 2840

Müller A., Fadini A., Peacock C.

Z. phys. Chem (DDR), 1968, 238, w1-2,

17-21/kein,
Berechnungen von Kraftkonstanten
anorganischer Verbindungen. I Berechn.
nung von Kraftkonstanten der
Hexafluoride der VI. Haupt- und Neben-
gruppe des Periodensystems mit
Prinzip, 1969, 30:68 15
20

SF₆, SeF₆, TeF₆, WF₆, ReF₆, OsF₆, IrF₆, PtF₆, 1968.

UF₆, NpF₆, PuF₆, PtCl₆, PdCl₆ (any. no. of)

Venkateswarlu K., Devi V.M., VI 4853 ~~17~~ ²/₂

Curr. Sci., 1968, 37 (13), 370-1

Urey-Bradley force field of some
XY₆ systems

to



15/10/68, G. V. V. 14, 54442 p.

SeF₆

TeF₆

Смесь.

Лазер-Раман спектр

(+1) ☒

С.А. 1971. 45. 14

1969-70

(02659w) Laser-Raman spectroscopy applied to the structural study of selenium and tellurium hexafluorides. Drifford, Maurice; Boucraut, M. T. (Dep. Physiochim., C.E.N. Saclay, Gil-sur-Yvette, Fr.). *Semin. Chim. Etat Solide* 1969-1970 (Pub. 1971), No. 4, 115-26 (Fr). The principle of laser Raman spectroscopy and its application esp. to the study of solids are discussed. Spectral data obtained for SeF₆ and TeF₆ are presented and discussed in detail.
H. L. Bogan

VII - 4975

1970

SF₆, SeF₆, TeF₆, MoF₆, TcF₆, ReF₆, UF₆

(Di)

Classen M. M., Goodman G. L.,

Holloway J. M., Helgert,

J. Chem. Phys., 1970, 53, 341-348

10

SF_6 , SeF_6 , TeF_6 , MoF_6 , WF_6 , (8 7) 1970=
 UF_6 , RuF_6 , RhF_6 , ReF_6 , (empty)
 OsF_6 , IrF_6 , PtF_6 , OsO_4 (43592) 6

Kaiser E.W., Chantler Y.S., Klem-
 perer W.A., Falconer W.E., Sunder
 Y. Chem. Phys., 1970, 53, No 4, W.A.,
 1444-42 (brev.)

Electric deflection of binary
 hexafluorides.

to Mr (b) CA 1970123, N14, 40310c

1970
M.N., cum. n. (SF₆, SeF₆, TeF₆, MoF₆,
VII-4909 TlF₆, RuF₆, RhF₆, WF₆,
ReF₆, OsF₆, IrF₆, PtF₆,
UF₆, NpF₆, PuF₆) 7 6 12

Thakur S.N., Rao D.V.R.A., Rai D.K.,
Indian J. Pure and Appl. Phys., 1970, 8,
v4, 196-198 (aun).

Extremal properties of force constants
in octahedral hexafluorides.

Pu Hua, 1971, 3567

E C D

φ.

H

②

paper, M. N. Choudhary (S F₆, Se F₆, Te F₆,
S F₅ Cl, S F₅ C F₃, S F₅ Br) XII 335
Ramaswamy K., Mohan N.,
J. molec. Struct., 1971, 7, N1-2,
51-52

Bagcut

PX 71.

W

SeF₆; TeF₆; MoF₆; SF₆; TmF₆; RhF₆;
PbF₆; WF₆; ReF₆; OsF₆; IrF₆; PtF₆ (м.п.) 1971

Шимонин В.С., Богнев И.Н., VIII 5610

Докл. науч. - тех. конф. Иванов.
хим. - технол. инст., 1971, 3-5 (русск.)

Посвящение Кармисова Взаим-
одействия молекул. октаэдрических.

10 170.

10



20

CA, 1973, 78, 124, 153203K

Tm F₆

1971

Timoshinin V.S. Godnev I.N.

u.v

Dokl. Nauch.-Tekn. Konf. Ivanov Khim.-
Tekhnol. Inst. 1971, 3-5.

(edi Ser₆; III)

S F₆, Se F₆, Te F₆, Mo F₆, W F₆, 1972
Re F₆, ~~Sn~~ Ir F₆, Pt F₆, U F₆, ² Pu F₆
(Vi, cur. noci.) VII 25635

Wendling E., Mahmondi S.,
Очистка и спектроск., 1972,
32 (3), 492-500

W (9)

ca 72⁹

SF₆

1973

Bosworth Y.M. Clark R.J.
Rippon D.M. "J.Mol.Spectrosc."
I983, 46, N2, 240-255.

h.h.

• (cur. SF₆; III)

Se F₆

Gilbert M.,
Driford M.

1973

exampl
K.p.

"Adv. Raman Spectrosc.
Vol. 1. Proc. 3rd Int Conf
Reims 1972" London e.a.
1973, 209-214 (pp. pg. annu)

● (see SF₆; III)

x. 1975. N^o 9

Do (F-WF₅)
Do (F-SeF₅)
Do (F-TeF₅)

XII 1157

1973

Harland P.W., Thyne J.C.J.,
Inorg. and Nucl. Chem. Lett.,
1973, 9, N2, 265-269 (anon.)

Comparison of negative ion
formation by the hexafluorides
of sulphur, selenium, tellurium
and tungsten. ○

Proc Chem, 1973, 12593

10

(7)

40402.9018
TE, Ch

SeF₆ 46505 02

1973
1961

Nagarajan G., Adams T.S. (am. SF₆; III)
Shrinkages of the internuclear distances in some hexafluorides of octahedral symmetry. "Monatsh. Chem.",
1973, 104, N 6, 1607-1622

(англ.)

0075

056 058 0 0 8

ВИНИТИ

молек. спектр., (SF₆; SeF₆; TeF₆; MoF₆; TcF₆; 1973
м.п., рачетом (RuF₆; RhF₆; WF₆; ReF₆; OsF₆,
IrF₆; PtF₆; UF₆; NpF₆; PuF₆)
Nagatajan G., Brinkley D.C., XII 1320

Monatsh. Chem., 1973, 104, N5, 1183-1202
(Chem.)

Moleküldynamik und Coriolis -
-Kopplungskoeffizienten einiger Hexa-
fluoride oktaedrischer Symmetrie.

ВхДум, 1974, 145201

10

Q22

WF₄; WF₅(A)

XII 1223

1973

SF_n⁻; TeF_n⁻; SeF_n⁻; WF_n⁻ (Do)
n = 4-6

Thynne J.C.J., Harland P.W.,
Int. J. Mass Spectrom. Ion Phys.,
1973, 11, N2, 137-47 (anon.)

Negative-ion formation by 12
tungsten hexafluoride.

10. (5)

CA, 1973, 78, N22, 140639c

40529.6692

Ch, Ph, TC

SeF₆ 46505 GR 03назвем
коллекции

1974

*45029

Baran E. J. Berechnung von mittleren
Schwingungsamplituden einiger oktaedri-
scher Hexafluoride nach der Methode der
charakteristischen Schwingungen. "Mo-
natsh. Chem.", 1974, 105, N 2, 362-365
(нем., рез. англ.)

(auf SeF₆; III)

099 101

U 110 423

ВИНИТИ

1974

Se F₆

Вюгленини средних амплитуд колебаний для некоторых октаэдрических гексафторидов литозом характеристических колебаний.

расчет
средние
ампл. колеб.

Валар Е. У., Monatshefte Chem
1974, 105, 12, 362-365 (нем)
рус (англ).

(см Se F₆; III)

Ф.1974. N 9.

Зак. 2

SF_6 , SeF_6 , TeF_6 , MoF_6 , WF_6 1974.
(vi) XII 1450

Gilbert M., Driffford M.,
Mol. Motions liq. Proc. Annu.
Meet. Soc. Chim. Phys., 24th,
1972, (Pub 1974), 279-86.

Raman Laser dynamic study of
metal and metalloid hexafluorides

C.A. 1975.82 v24. 162303w. 10 Φ 6

50411.9035

Ch, TC

48588

SF₆

XII-1417

1974

3191

Nagarajan G., Adams Th.S.Root-mean-square amplitudes in some
hexafluorides of octahedral symmetry.

"Z. phys. Chem." (DDR), 1974, 255,

N 5, 869-888

(см SF₆; III)

(англ.)

0343 пик

312 314

3 3 5

ВИНИТИ

$\text{SF}_6, \text{SeF}_6, \text{TeF}_6$ (pocum J) XII-1573 1974

Rösch N., Smith V. H., Jr, Whang M. H.
J. Amer. Chem. Soc., 1974, 96, 219, 5984 -
5989 (ann.)

SCF-X scattered wave studies on bonding
and ionization potentials. I. Hexafluor-
ides of group VI elements.

PME. Ann., 5541, 1975 10

72

BrO_2F (ox), SeO_2F (Ti, pavan) 1975
75

Gillespie R. J., Spekkenz P. 12.

J. Chem. Soc., Chem. Commun.,
1975, (9), 314-16. 11 45 15

Raman spectrum and structure
of bromyl fluoride. 11.15.75

C.A. 1975. 83w10. 84715x.

10



Se F₆

XII-1512

1975

Ramaswamy K., et al.

(cur. no. 1, vi) Acta Chim. Acad. Sci. Hung.,
1975, 87, N1, 7-13.

(cur SF₆) III

Se F₆

1975

Rytter E.

расчет пол-
ной потемк.
и кинетич.
теплоты.

Acta chim Acad sci hung"
1975, 85, N2, 147-151 /англ. яз.
рус.)

(см SiO₄ III)

~~Bsp - 1589 - XII~~
60525.8491

B, Ch, TC

35223

SeF₆ (V4) *

1976

4-13139

Brooks W. V. F., Eshaque M., Lau Clement, Passmore Jack. The vibrational spectrum and normal coordinate analysis of tellurium chloride pentafluoride. "Can. J. Chem.", 1976, 54, N 5, 817-823 III (au Tell₅)
(англ., рез. франц.) 0627 лнк

600 604

6 1 0

ВИНИТИ

Se 75
Se 76

1976.

Горюхан Н. М. и др.

(электр.
срвен.)

2, координат. кл. 1976,
№ 7, 878-84.

(all. Si 75 Cl²⁻) III

Se Fc

1976

Prindley A.N., et al.

Acta Cienc. Indica,
1976, 2(1), 63-72.

(incl. used.
sp. kl. all.
used.)

(all PFG-) III

70422.6704

Ch, Zh, TC

96201

 $SeF_6 (Ae)$

1977

X4-18022

Boring Michael. Calculated electron
affinities of a selected series of
hexafluorides. "Chem. Phys. Lett.", 1977,
45, N 2, 242-244 (англ.)

(см. SF_6 ; ин)

0860 1211

829 832 0 5 1'

ВИНИТИ

SeF₂

1977

Haas A., et al

u.k.chem

Int. Conf. Matrix

Isolat. Spectrosc.

6 maspage

Discussionstag. Dt. sch.

Bunsen-Ges. Phys. Chem.

West-Berlin, 1977. Extended
abst., Berlin, S. 2. 41-42.

(see SF₂; III)

SeF_6

1977

5 Д411. Изучение контуров колебательных полос SeF_6 спектроскопическими методами при низких температурах и матричной изоляции молекул с использованием изотопического замещения. Силовые постоянные молекул SeF_6 . Königer F. Müller A. Selig H.
— SeF_6 vibrational band contours studied by low temperatu-

re and matrix isolation spectroscopy, using isotope substitution. Force constants of SeF_6 . «Mol. Phys.», 1977, 34, № 6, 1629—1635 (англ.)

Получены ИК-спектры $^{80}SeF_6$ (I), $^{76}SeF_6$ и $^{82}SeF_6$ производных I в матрицах N_2 и Ar при т-ре $20^\circ K$, а также ИК-спектры газообразного I и его изотопзамещенных аналогов при т-ре $300^\circ K$. Выполнен анализ контуров ИК-полос колебаний ν_2 (типа симметрии F_{1u}) и ν_4 (типа F_{1u}) I. Отмечено изменение значений частот ν_2 и ν_4 при вариации содержания изотопов I в матрицах N_2 и Ar. Вычислены значения силовых констант колебаний типа F_{1u} с учетом изотопич. смещений и констант корiolисовых взаимодействий в I. Библ. 13. И. В. А.

см. и: Di

Ф. 1348, N 5

SeF₆

1947

(Di, Ensmoer; W.K. Calkins; B. Calkins)

89: 33473x Selenium hexafluoride vibrational band contours studied by low temperature and matrix isolation spectroscopy,

using isotope substitution. Force constants of selenium hexafluoride. Koeniger, F.; Mueller, A.; Selig, H. (Fak. Chem., Univ. Bielefeld, Bielefeld, Ger.). *Mol. Phys.* 1977, 34(6), 1629-35 (Eng). The IR spectrum of SeF₆ was studied using the matrix isolation and isotopic substitution techniques. The band contours of $\nu_3(F_{1u})$ and $\nu_4(F_{1u})$ could be obtained from the spectrum of isotopically pure ⁸⁰SeF₆ at low temp. For both vibrations, isotopic shifts due to ⁷⁴Se, ⁷⁶Se, ⁷⁷Se, ⁷⁸Se, ⁸⁰Se, ⁸²Se were obtained in both Ar and N₂ matrixes. The F_{1u} force consts. were calcd. using the isotope shifts and Coriolis coupling consts.

C.A. 1978, 29, NY

SeF₆
TeF₆

(Ae⁻)

(+1) ∇

XII-1832a 1978

18 Б77. Ионизация при столкновениях между быстрыми атомами щелочных металлов и некоторыми молекулами гексафторидов. Compton R. N., Reinhardt P. W., Cooper C. D. Collisional ionization between fast alkali atoms and selected hexafluoride molecules. «J. Chem. Phys.», 1978, 68, № 5, 2023—2036 (англ.)

Измерены зависимости сечений образования различных отриц. ионов при столкновениях в скрещенных молек. пучках атомов щелочных металлов (Na, K, Cs) и молекул гексафторидов MF₆ (M=S, Se, Te, Mo, W, Re, Jg, Pt) от энергии относит. движения сталкивающихся частиц и определены пороги р-ций. Измерены зависимости порогов образования отрицат. ионов от т-ры молекул мишени MF₆, на основании чего для M=S, Se, Te получены значения сродства к электрону соотв. $0,46 \pm 0,2$, $2,9 \pm 0,2$ и $3,3 \pm 0,2$ эв. Измерены также зависимости от т-ры порогов появления SF₃⁻ при столкновениях SF₄ с атомами щел. металлов, на основании к-рых,

x, 1978, N 18

а также зависимостей от т-ры порога появления $\dot{SF}_5^-$ из SF_6 , определены значения сродства к электрону SF_n . Для $n=6, 5, 4, 3$ получены, соотв., значения $0,46 \pm 0,2$, $2,71 \pm 0,2$, $0,78 \pm 0,2$ и $3,07 \pm 0,2$ эв. Установлено, что для $M=Mo, W, Re, Jg$ и Pt ионы MF_6^- наблюдаются при т-ре молек. пучков щел. металлов в интервале $100-300^\circ$, на основании чего для миним. значения сродства к электрону MF_6 для перечисленных M получена величина 5,3 эв.

Е. Николаев

SeF₆
TeF₆

Ае⁻
ионизация
при
столкн.

(+1) ☒

ф. 1978, № 10

Эксперим. и теоретич. данные. Ввод. 20.

10 Д216. Ионизация при столкновениях быстрых атомов щелочных металлов с шестифтористыми молекулами. Compton R. N., Reinhardt P. W., Cooper C. D. Collisional ionization between fast alkali atoms and selected hexafluoride molecules. «J. Chem. Phys.», 1978, 68, № 5, 2023—2036 (англ.)

Исследованы процессы столкновений атомов А (А≡Na, K, Cs) с шестифтористыми молекулами MF₆ (М≡S, Se, Te, Mo, W, Re, Ir, Pt) в диапазоне энергий атомов ~0—40 эв. При измерениях использовалась ранее описанная, но несколько усовершенствованная эксперим. установка (Nalley S. J. et al., «J. Chem. Phys.», 1973, 59, 4125). Более подробно изучены молекулы SF₆, SeF₆ и TeF₆, для которых выяснено влияние т-ры мишени Т на пороги реакций типа А+MF₆→→А⁺+MF₆⁻, →А⁺+MF₅⁻+F, →А⁺+MF₅+F⁻ и определены скорректированные к Т→0 величины электронного сродства (ЭС), которые оказались равными (в эв): 0,46±0,2 (SF₆), 2,9±0,2 (SeF₆) и 3,3±0,2 (TeF₆). С приведенными значениями ЭС согласуются данные, полученные из измерений энергетич. потерь атомами А в реакциях А+MF₆→А⁺+MF₆⁻ при малых углах рассеяния ЭС для падающих молекул SF_n (n=5, 4, 3).

1978

18322
XII-11X

SF₆
☒

Se F₆

1978

Clark R. J. et al.

J. Chem. Soc., Dalton Trans. 1978,
(2), 140-3 (Eng)

v.

ex. S F₆ - III

Se F₆

1978

Fadini A, et al.

Spectrochim. acta 1978,
34, N9, 853-55.

(vi)

ex. S F₆ - III

SeF_6

Коммиссия 9962

1980

Barq S.K., et al.

группа
связи
ЯМР-
анализ

J. Mag. Resonance,
1980, 39, 317-319

Отпуск

9257

1980

SeF₆

7 Д135. Нерелятивистские и релятивистские молекулярные расчеты гексафторидов халькогенов SF₆, SeF₆, TeF₆, PoF₆. Non-relativistic and relativistic molecular calculations for the chalcogen hexafluorides: SF₆, SeF₆, TeF₆, PoF₆. Grundevik P., Rosén A., Fricke B., Morovic T., Sepp W.-D. — Contributed Papers from the XIV th European Congress on Molecular Spectroscopy, Frankfurt, Sept., 1979. Part 2. — «J. Mol. Struct.», 1980, 60, 381—386 (англ.)

γ, ε_i

(+2)



Релятивистским Х_α-методом дискретного варьирования рассчитана электронная структура октаэдрич. молекул SF₆, SeF₆, TeF₆, PoF₆ с использованием миним. базиса. С утяжелением центрального атома наблюдается сужение F 2s полосы и уменьшение величины первого потенциала ионизации с 14,5 до 12,7 эв. Проведен также нерелятив. расчет в расширенном базисе с включением 3d, 4s, 4p, 4d, 4f орбиталей атома S для молекулы SF₆. Полученные результаты сопоставлены с имеющимися эксперим. и теоретич. данными. Библ. 18.

А. Ф. Шестаков

Р. 1980. №7

Отпуск

9257 см SF₆; III

оптиск 10113

1980

SeF_6

1 Д400. Обратимые температурные изменения параметров ИК-полос и динамика точечной структуры молекул SeF_6 , изолированных в криптоновой матрице. Temperature reversible ir spectral changes and site structure dynamics for SeF_6 isolated in krypton matrices. Jones Llewellyn H., Swanson B. I., Ekberg S. A. «Chem. Phys. Lett.», 1980, 74, № 2, 330—332 (англ.)

и.к. спектр
2i;

Получены ИК-спектры ($767\text{—}781\text{ см}^{-1}$) молекул SeF_6 (I), изолированных в криптоновой матрице при т-рах $9\text{—}39^\circ\text{K}$ с фурье-преобразованием спектра и разрешением $0,04\text{ см}^{-1}$. Идентифицированы компоненты тонкой структуры ИК-полосы ν_3 I, обусловленные изотопич. составом ^iSe в I ($i=76, 77, 78, 80$ и 82). Обнаружены резкие обратимые изменения относит. интенсив-

ф. 1981 N 1

ности и полуширины компонент ИК-полосы ν_3 I при вариации т-ры. Предположено, что наблюдаемое расщепление ряда компонент ИК-полос ν_3 I при т-ре ниже 15°K связано с понижением симметрии матричных ячеек от T_d до C_{3v} . Сделан вывод, что при низкой ($\sim 9^\circ\text{K}$) т-ре движение молекул I по эквив. положениям матричных ячеек замедлено, тогда как при т-ре выше 15°K происходит динамич. обмен молекулами I в усредненной матричной структуре с высокой (T или T_d) симметрией.

И. В. А.

SeF₆

Отмечено 12049 1981

12 Д501. Исследования динамики в низкотемпературных матрицах методом ИК-спектроскопии высокого разрешения: колебательная дефазировка SeF₆ в инертных матрицах. High resolution infrared studies of dynamics in low temperature matrices. Vibrational dephasing for SeF₆ in noble gas solids. Jones Llewellyn H., Swanson Basil I. «J. Chem. Phys.», 1981, 74, № 6, 3216—3224 (англ.)

В области 760—790 см⁻¹ получены спектры поглощения молекул SeF₆ в Ar-, Ne-, Kr- и Xe-матрицах. Высокая разрешающая способность спектрографа позволила исследовать компоненты моды ν_3 (SeF₆) и проследить за изменениями спектра при варьировании т-ры в области 3—40 К. Показано, что набор состояний SeF₆ в матрицах и характер расщепления этих состояний аналогичны набору, полученному при исследованиях молекул SF₆ в матрицах. По температурным зависимостям интенсивностей полос оценено взаимодействие молекул SeF₆ с окружением. Отмечено, что наблюдавшиеся изотопич. сдвиги в спектрах можно использовать.

спектры
в матри-
цах,
Vi;

ф. 1981, Л8, № 12.

для построения потенциалов взаимодействия молеку-
ла — матрица. Библ. 23. М. Т.



SeF_6

1981

Manivannan G.,
et al.

век. посыл.,
посыл. цен-
тробезм.
расшир.

Indian J. Phys.,
[Part] B 1981, 55B (2),
171-174.

(см. SF_6 ; III)

SeF₆

Оммух 14444

1982

сил. пост.,
средние
асинхрон-
ные
колеба-
нии

Chinnappan V. A., Nata-
rajan A.,

Pramana J. Phys., 1982,
18, N6, 501-509.

SeF_6^+

1982

Baran E.J., Lavat A.E.

Indian J. Pure and

Chem.
Appl.

Phys., 1982, 20, #2,

152-153.

($\bullet$ BrF_6^+ ; III)

SeF_6

Ommick 15481
Ommick 15595

1982

колебат.
частоты

Bass H.E., Jensen V.,
Ezell J.,

J. Chem. Phys., 1982,
77, N8, 4164-4168.

SeF_6

1982

Гуцев Т. П., Кедри-
на А. П.

равный
электрон.
свойств.,

Ж. Неорган. химии,
1982, 27, № 9, 2173-2178.

Fe

(сод. SF_6 ; III)

Set 6

[Om. 16346]

1983

Gutsev G. L., Klyagina
A. P.,

рацем
измер.
кристалл

Chem. Phys., 1983, 75,
N2, 243-252.

SeF₆_{p-p}
v Xe 4 CH₄

1983

Holland Redus, Maier
William B., et al.

crxmp
et. n.

J. Chem. Phys., 1983,
78, N11, 6405-6414.

●
(an. BiCl₃_{p-p}) III

Set-6

[Om. 17343]

1983

Jones L.H., Swanson B.I.,

спектры
в
матрицах

J. Chem. Phys. 1983,
79, N 3, 1516-1522.

SeF₆

1983

6 Д95. Теоретический расчет обобщенного валентно-силового поля октаэдрических молекул. Романов А. В., Якшин В. В., Ласкорин Б. Н. «Докл. АН СССР», 1983, 273, № 6, 1428—1430

На примере SeF₆ произведен замкнутый расчет силового поля октаэдрич. молекулы по известным частотам норм. колебаний и *P—R*-сдвигам наблюдаемых в ИК-спектре частот $\nu_3(F_1^4)$ и $\nu_4(F_1^4)$. Получена разрешимая система ур-ний (с использованием кориолисовых постоянных) без привлечения данных по изотопзамещенным молекулам. Автореферат

см. пост.

ор. 1984, 18, N 6

SeF₆

1983

11 Б1167. Теоретический расчет обобщенного валентно-силового поля октаэдрических молекул. Романов А. В., Якшин В. В., Ласковин Б. Н. «Докл. АН СССР», 1983, 273, № 6, 1428—1430

Исходя из эксперим. частот колебаний, 4 дополнительных ур-ний, вытекающих из условий «чрезмерности» (J. Mol. Spectrosc., 1961, 6, 272) ($f_{r\alpha'}=0$, $f_{r\alpha''}=-f_{r\alpha}$, $f_{\alpha\alpha'''}=-f_{\alpha\alpha}f_{\alpha\alpha'''}=-f_{\alpha}-2f_{\alpha\alpha'}$ ур-ния связывающего силовые постоянные с кориолисовыми постоянными ξ_{33} и ξ_{44} , получаемыми экспериментально и R, P сдвигов полос колебаний ν_3 и ν_4 рассчитаны параметры обобщенного валентно-силового поля ($f_r, f_{rr}, f_{r\alpha}, f_{\alpha\alpha}, f_{\alpha\alpha'}$) молекул SeF₆, WF₆, UF₆. Значения силовых постоянных (в мдн/А): SeF₆—5,324, 0,1175, —0,069, 0,2663, 0,3997, 0,048, —0,1147; WF₆—5,23, 0,2533, 0,43, 0,045, 0,1625, 0,0225, —0,0725; UF₆—6,769, 0,298, 0,0171, —0,0074, 0,0948, 0,0048, —0,0280. В. М. Ковба

сил. пост., ν_i

(+2) ~~18~~

х. 1984, 19, № 11

SeF₆

1983

100: 147589r Theoretical calculation of generalized valence force field of octahedral molecules. Romanov, A. V.; Yakshin, V. V.; Laskorin, B. N. (USSR). *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 1983, 273(6), 1428-30 [Phys. Chem.] (Russ). Generalized valence force fields of MF₆ (M = Se, U, W) octahedral mols. were obtained by solving the inverse spectroscopic problem for these mols. Good agreement with the exptl. detd. frequencies of normal vibrations was obsd. at room temp.

Chem. NDCM .

(+2) ~~17~~ UF₆, WF₆ ●

C.A. 1984, 100, N 18

SeF₆

(Am. 19846)

1984

101: 137399k Electron diffraction analysis of charge redistribution model and structure of selenium hexafluoride. Bartell, Lawrence S.; Jin, Anding (Dep. Chem., Univ. Michigan, Ann Arbor, MI 48109 USA). *J. Mol. Struct.* 1984, 118(1-2), 47-52 (Engl). The bond length of the octahedral mol. SeF₆ is 1.685(2) Å. Mean amplitudes of vibration, measured by diffraction, are within the exptl. error of those calcd. from spectral data. Systematic residuals in scattered intensities are examd. in the light of the observation that residuals for SF₆ result principally from the disparity between the actual electron distribution and that of the independent atom model (IAM) of std. analyses. A modified version of IAM (MIAM), retaining spherical atoms as in IAM but shifting net charge and at. radii, somewhat in the manner of Hehre et al., (1983) was tested. The MIAM approach worked too imperfectly to warrant routine incorporation in diffraction analyses.

2
Se-F, π back-
bonding.

c.A. 1984, 101, N16

SeF₆

Дм. 19846

1984

24 Б1106. Электронографический анализ модели перераспределения заряда и структуры SeF₆. Electron diffraction analysis of charge redistribution model and structure of SeF₆. Bartell Lawrence S., Jin Anding. «J. Mol. Struct.», 1984, 118, № 1—2, 47—52 (англ.)

Предпринята попытка объяснить систематич. разницу в теор. рассчитанных и эксперим. значениях интенсивностей с помощью приближенного учета различия между действительным распределением электронной плотности и моделью независимо рассеивающих атомов. На основании проведенных расчетов выяснилось, что использованная модель слишком груба для применения в серийном электронографич. структурном анализе. Найдено $r_g(\text{Se—F}) = 1,685 (2) \text{ \AA}$. В. П. Спиридонов

структура

Х. 1984, 19, № 24

SeF₆

DM 19846

1984

1 Д50. Электронный дифракционный анализ модели перераспределения заряда и структура SeF₆. Electron diffraction analysis of charge redistribution model and structure of SeF₆. Bartell Lawrence S., Jin An-ding. «J. Mol. Struct.», 1984, 118, № 1—2, 47—52 (англ.)

Измерена длина связи октаэдрич. молекулы SeF₆ $r_s(3\sigma) = 1,685$ (2) Å. Измеренные с помощью дифракции электронов средние амплитуды колебаний с точностью до ошибки эксперимента совпадают с рассчитанными ранее из спектральных данных. Систематич. отклонения расчетных интенсивностей рассеяния от экспериментальных, как и в случае молекулы SF₆, возникают, главным образом, вследствие отклонения реального распределения электронов от распределения, получаемого в рамках модели независимых атомов. Сделана попытка улучшить эту модель, сохраняя сферичность атомов, но изменяя заряд и атомный радиус. Однако и такая модель не достаточно хорошо описывает эксперим. данные по дифракции электронов. Г. К.

геометрия,
структура

ф. 1985, 18, N1.

S & F₆

[Oct. 22/25]

1984

См. пост,
средние
амплитуды
колебам.,
наблюдения
характера и
густоты связей.

Savarathy R.,
Ramasamy R.,

Indian J. Phys., 1984,
B58, N4-5, 464-472.



SeF_6

1985

Kuze Hiroaki, Takami
Michio.

ИК спектры
лазерн. спектр
в сверхзвуковой
среде

Oyo Butsuri 1985,
54 (7), 694-7.

● (см. SF_6 ; III)

SeF₆

1984

Sabapathy K.,
Ramasamy R.

Vi, cur.
no cur.

Indian J. Phys., 1984,
B58, N4-5, 464-472.

(cur. SF₆; III)

SeF₆

(cm. 22 260)

1985

Stanton J. F., Bartell L. S.,

те и
судов.
немоетт.

J. Phys. Chem., 1985, 89,
N 12, 2544-2549.

1986

SeF_6

Pösch N., Pyrkko P.

et. n. Mol. Phys., 1986, 57,
N1, 193-200.

(ср. ● XeF_2 ; III)

Set 6

Om. 23774

1986

Takami M.,

ν_3 ,

u.n.

J. Chem. Phys., 1986,
84, N 1, 73-77.

SeF₆

(DM-28787)

1987

Geldard J.F., McDowell H.K.,

Spectrochim. Acta, 1987,

43A, N3,

Chem.
noem.

ДФб

[От. 30873]

1989

Осипова Т. Е., Морченко Э. М.,
и др.,

сильн. пост.,
частоты
морозов,
колебаний

Ж. структур. динамика,
1989, 30, № 50-54,

Расчеты селеновых носей гек-
сафторидов S, Se, Te.

SeF₆ 1990
Fernandez-Gomez Manuel,
Lopez-Gonzalez, Juan Jesus
et al.

распределен
сечений
поверхности -
ных
J. Mol. Struct. 1990,
220, 287-300.

(сер. SF₆; III)

SeF_6

Бжов Ю.с.

1990.

Структура и энерг. молекулы:

Тр. 5 Всес. совещ. по изуч. струк-
туры молекулы в газ. фазе,

Л. П. Иванова, 11-14 июня, 1990; лек-
ция сб. науч. тр. Иванова,
1990. с.

101-107.

(см. SF_6 ; III)

SeF₆

[om 35646]

1991

Синков Ю. С.,

зарядовая.
частоты,
Синков.
постоян.

жн. физ. химии, 1991,
65, №, 1976-1979.

1993

TeF_6
 TeF_6^{2-}

Кловиковски, М.,

стабилност,
структура,
теор. рачун

J. Comput. Chem. 1993,
14 (10), 1234-9.

(all. TeF_6 ; III)

SeF₆

1994

Onoe Jun, Sekine
Rika et al.

Chem. Phys. Lett. 1994.
217, N1-2.C. 61-64.

( SF₆; III)

1995

F: SeF₆

P: 3

0538071

9Б1180. Прямая оценка равновесных геометрий молекул с использованием газовой электронографии в реальном времени. 2. Гексафторид селена. Direct evaluation of equilibrium molecular geometries using real-time gas electron diffraction. 2. Selenium hexafluoride / Maggard Paul, Lobastov Vladimir A., Schafer Lothar, Ewbank John D., Ischenko Anatoli A. // J. Phys. Chem. - 1995. - 99, N 35. - С. 13115-13117. - Англ.
Место хранения ГПТБ

Методом газовой электронографии (т-ра 298-573К) исследована структура молекулы SeF₆. При анализе, учитывающем температурную зависимость распределения интенсивности в экспериментальной электронограмме, рассмотрено влияние: кумулянтов более высокого порядка, многократного рассеяния, использованной модели ангармонических колебаний морзевского типа. Величина $R[e](\text{Se-F})=1,6784 \text{ \AA}$.

X. 1996, N 9

SeF₆

On 38071

1995

123: 123726g Direct Evaluation of Equilibrium Molecular Geometries Using Real-Time Gas Electron Diffraction. 2. Selenium Hexafluoride. Maggard, Paul; Lobastov, Vladimir A.; Schaefer, Lothar; Ewbank, John D.; Ischenko, Anatoli A. (Department of Chemistry and Biochemistry, University of Arkansas, Fayetteville, AR 72701 USA). *J. Phys. Chem.* 1995, 99(35), 13115-17 (Eng). Gas electron diffraction (GED) data for SeF₆ were recorded with the University of Arkansas real-time diffractometer in the temp. range 298-573 K. The effects of higher-order cumulants, of multiple scattering, and of an assumed asymmetry Morse-like const. on the results of the anal. were investigated. Temp.-dependent mol. GED intensities can be useful in assigning high-resoln. vibration-rotation spectra of mols. contg. heavy central atoms and in testing the accuracy of mol. force fields obtained from spectroscopy. Applying the cumulant method for analyzing GED data, $r_s(\text{Se-F}) = 167.84$ (8) pm was obtained.

2ay. Temp.
Korpaqul

C.A. 1995, 123, N10

SeF6

F: SeF6

P: 3

Om 38071

1995

06.Д.0032. Прямое определение равновесных молекулярных геометрий с использованием электронной дифракции в газовой фазе в реальном времени. 2. Гексафторид селена. Direct evaluation of equilibrium molecular geometries using real-time gas electron diffraction. 2. Selenium hexafluoride / Maggard Paul, Lobastov Vladimir A., Schafer Lothar, Ewbank John D., Ischenko Anatoli A. // J. Phys. Chem. - 1995. - 99, N 35. - С. 13115-13117. - Англ.

Gas electron diffraction (GED) data for SeF₆ were recorded with the University of Arkansas real-time diffractometer in the temperature range 298-573 K. The effects of higher-order cumulants, of multiple scattering, and of an assumed asymmetry Morse-like constant on the results of the analysis were investigated. The study illustrates that temperature-dependent molecular GED intensities can be useful in assigning high-resolution vibration-rotation spectra of molecules containing heavy central atoms and in testing the accuracy of molecular force fields obtained from spectroscopy. Applying the cumulant method for analyzing GED data, $r_e(\text{Se-F}) = 167.84$ (8) pm was obtained.

X, 1996, N6

SeF₆

1997

(FTIR-check)

127:363651e Study of the $\nu_3 = 1$ state of $^{80}\text{SeF}_6$ by Fourier transform spectroscopy. Terki-Hassaine, M.; Pierre, G.; Burger, H.; Willner, H. (Lab. Phys., Univ. Bourgogne, F-21011 Fr.). *J. Mol. Spectrosc.* 1997, 185(1), 93-97 (Eng), Academic. The FTIR spectrum of monoisotopic $^{80}\text{SeF}_6$ was recorded at 760-792 cm^{-1} with an effective resoln. of $-2.3 \times 10^{-3} \text{ cm}^{-1}$. The $^{80}\text{SeF}_6$ sample was prepd. by burning monoisotopic ^{80}Se powder (99.2%) in an excess of F. The anal. of IR transitions of the ν_3 band enabled the detn. of parameters of the Hamiltonian developed up to the 3rd order and the 4th order. The std. deviation obtained is $4 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$ for the 3rd-order development and $3.2 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$ for the 4th-order development. In the 2 analyses, 2900 lines were assigned and fitted.

C. A. 1997, 127, N 26

$^{80}\text{Se F}_6$
 ν_4

High-resolution spectroscopy
and analysis of the ν_4 band
of $^{80}\text{Se F}_6$.

2001

of 40801⁴

Rodger M., Brudon V., Burger H.,
Willner K.,

Chem. Phys. Lett. 2001, 331(1-2),
p83-88.

Фле-панс. енерг. б. одл. 435cm^{-1} (ν_4)
записана при $t=217^\circ\text{K}$ с погреш-
ностью $2.3 \cdot 10^{-3}\text{cm}^{-1}$. $\nu_4 = 435,093\text{cm}^{-1}$.

CA, 135, 19, 2001
1128950h

Set 6

Om. 40801 A11
11

2001

Rotger M., Boudon V.
et al.,

ν_4

Chem. Phys. Lett., 2001,
339, 83-88.

High-resolution
and analysis



spectroscopy
of the ν_4 band

10 80 Fe_6 .

